

© 1993

## ЛИНЕЙНЫЙ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В *p*-GaSb В ИК И СУБМИЛЛИМЕТРОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА

*E. V. Берегулин, С. Д. Ганичев, К. Ю. Глух,  
Ю. Б. Лянда-Геллер, И. Д. Ярошецкий*

Излагаются результаты экспериментального исследования линейного фотогальванического эффекта в кристаллах *p*-GaSb.

Линейный фотогальванический эффект (ЛФГЭ) возникает в однородных кристаллах при равномерном освещении и обусловлен анизотропией процессов фотовозбуждения, рассеяния и рекомбинации в кристаллах без центра инверсии. В полупроводниках этот эффект широко изучался в инфракрасном (ИК) [1] и субмиллиметровом диапазоне [2–4]. Настоящая работа посвящена обнаружению и исследованию этого эффекта в кристаллах *p*-GaSb при возбуждении светом в широком диапазоне частот (9–400 мкм). Результаты исследований позволяют сделать выводы об общих закономерностях ЛФГЭ в субмиллиметровом диапазоне в кристаллах  $A_3B_5$ .

### Методика эксперимента и результаты

Эксперименты проводились на кристаллах *p*-GaSb с концентрацией носителей  $p = 1.2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  в диапазоне температур 78–300 К. В качестве источника излучения использовался импульсный  $\text{CO}_2$  лазер и  $\text{NH}_3$  лазер с оптической накачкой. Длина волны линейно-поляризованного света составляла 9.2, 90.5, 152 и 385 мкм. Изучалась зависимость фотоэдс и коэффициента поглощения от температуры и длины волны излучения. Свет падал на образец, который представлял собой плоскопараллельную пластинку, вырезанную вдоль кристаллографического направления [111]. На торцах образца были расположены два электрических омических контакта. Фототок измерялся вдоль направления [112].

Обнаруженный при возбуждении светом всех длин волн сигнал эдс повторял форму лазерного импульса с длительностью 40 нс. При повороте плоскости поляризации излучения вокруг направления [111] наблюдаемая эдс зависела от угла  $\theta$  между вектором поляризации и направлением [112] как  $\cos 2\theta$  (рис. 1). Поворот образца вокруг [112] на  $180^\circ$  при неизменном направлении распространения излучения не приводит к изменению полярности сигнала.

Такое поведение эдс полностью соответствует феноменологическому выражению для фотогальванического тока в кристаллах симметрии  $T_d$  [1], к которым относится GaSb

$$j_\alpha = IX |\delta_{\alpha\beta}| e_\beta e_\gamma, \quad (1)$$

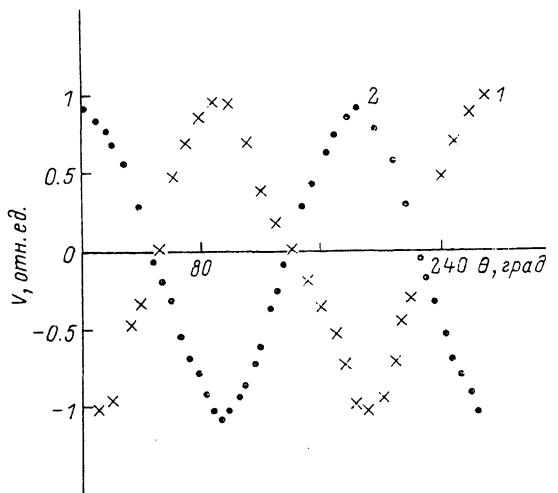


Рис. 1. Зависимость фотоответа от угла  $\theta$  между вектором поляризации света и направлением  $\{11\bar{2}\}$  в  $p$ -GaAs при  $p = 1.2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  и  $T = 300$  (1) и  $78$  К (2).

где  $j$  — плотность тока,  $I$  — интенсивность световой волны,  $e$  — вектор поляризации,  $\delta_{ab}^{\alpha\beta}$  — единичный антисимметричный тензор,  $\chi$  — единственная линейно-независимая компонента тензора ЛФГЭ.

Выражение для фототока в направления  $[11\bar{2}]$  при падении излучения вдоль кристаллографического направления  $[111]$  имеет вид

$$j_{[11\bar{2}]} = I \frac{\chi}{\sqrt{6}} \cos 2\theta. \quad (2)$$

Эксперименты показали, что величина константы  $\chi$  при  $T = 300$  К практически не зависит от длины волны в диапазоне длин волн  $90$ — $400$  мкм и уменьшается при меньших длинах волн (рис. 2). Наблюдаемая эдс зависела от температуры и при увеличении температуры изменяла знак (рис. 3). Аналогичное поведение эффекта наблюдалось нами в  $p$ -GaAs [2, 3].

Экспериментально определенный коэффициент поглощения света в  $p$ -GaSb для  $p = 1.2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  при  $T = 300$  К на длине волны  $9.2$  мкм составил  $\sim 170 \text{ см}^{-1}$ , а в области длин волн более  $90$  мкм был равен  $\sim 240 \text{ см}^{-1}$  и не зависел от длины волны.

### Обсуждение результатов

Механизм формирования ЛФГЭ и поглощения излучения в полупроводниках  $A_3B_5$   $p$ -типа в ИК и субмиллиметровом диапазонах при температуре, когда примеси ионизованы, может определяться как прямыми оптическими переходами между ветвями тяжелых и легких дырок вырожденной валентной зоны, так и непрямыми оптическими переходами.

В ИК диапазоне ( $\lambda \sim 9$  мкм), где величина поглощения при прямых переходах существенно (на два порядка) больше поглощения при непрямых переходах,

фототок связан с прямыми оптическими переходами между подзоной тяжелых и легких дырок.

С увеличением длины волны коэффициент поглощения света при прямых переходах значительно падает, а коэффициент поглощения на непрямых переходах растет. Эксперименты по температурной и

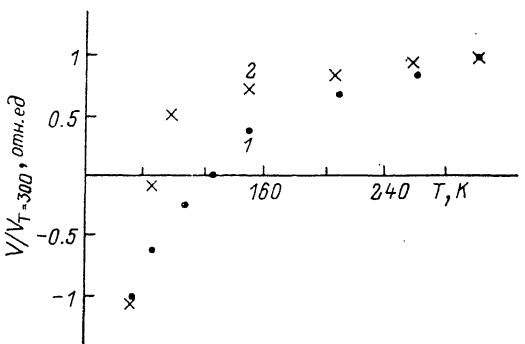
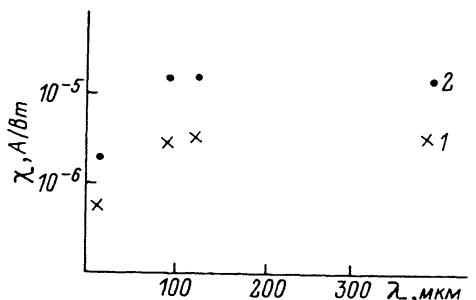


Рис. 2. Зависимость фотоответа  $p$ -GaAs при  $p = 1.2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$  от температуры для длин волн  $\lambda = 9$  (1) и  $90.5$  мкм (2).

Рис. 3. Зависимость константы  $\chi$  ( $T = 300$  К,  $p = 1.2 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$ ) от длины волны в  $p$ -GaAs (1) и  $p$ -GaSb (2).



частотной зависимостью показывают, что в  $p$ -GaSb при  $T = 300$  К, как и в  $p$ -GaAs [2, 3], при длине волны 90 мкм и более поглощение связано в основном с непрямыми переходами с участием полярных оптических фононов и не зависит от длины волны. Отсутствие зависимости от длины волны коэффициента поглощения

соответствует классической формуле Друде при реализуемом в эксперименте условии  $\hbar\omega \ll kT$ ,  $\omega\tau \ll 1$ , где  $\tau$  — время релаксации импульса. При этом соотношение между абсолютными значениями величин поглощения в GaSb и в GaAs для  $\lambda > 90$  мкм удовлетворительно описывается формулой для непрямых переходов с участием оптических фононов ( $\hbar\omega_L = 29$  мэВ для GaSb и  $\hbar\omega_L = 36$  мэВ для GaAs) в пределах подзоны тяжелых дырок [2].

Наблюдаемое в эксперименте отсутствие спектральной зависимости при  $\lambda > 90$  мкм как коэффициента поглощения, так и константы  $\chi$  позволяет сделать вывод, что непрямые переходы играют основную роль в формировании ЛФГЭ.

Таким образом, в  $p$ -GaSb, как и в  $p$ -GaAs [2–4], ответственными за величину ФГЭ являются те же оптические переходы, которые определяют коэффициент поглощения света. Подробное рассмотрение механизмов образования фототока для такого случая было проведено ранее в ИК области в [1], а в субмиллиметровой области спектра — в [2–4].

Наблюдаемый в эксперименте рост  $\chi$  при переходе от  $\lambda \sim 9$  мкм к  $\lambda > 90$  мкм при близких величинах коэффициента поглощения обусловлен увеличением роли асимметричного рассеяния на ионизованных примесях в связи с понижением энергии  $\epsilon_i$ , состояний, участвующих в образовании фототока, и исчезновением процессов испускания оптических фононов ( $\epsilon_i < \hbar\omega_0$ ).

Температурная зависимость как в GaSb (рис. 2), так и в GaAs [2, 3] указывает на смену механизма ЛФГЭ при переходе от  $T = 300$  К к  $T = 77$  К. Изменение величины эффекта при  $T < 300$  К связано с температурной зависимостью числа фононов, которое определяет в значительной степени механизмы как фотовозбуждения, так и релаксации фотоносителей. С понижением температуры происходит вымораживание носителей на примесь и становятся существенными переходы с примесного уровня в зону. Это приводит к фототоку, связанному с этими переходами, и соответственно к смене направления полного тока.

В заключение отметим, что наблюдаемые в  $p$ -GaSb в сравнении с  $p$ -GaAs существенно большие величины константы  $\chi$  (рис. 2) позволяют использовать этот материал в быстродействующих измерителях поляризации ИК—СБММ излучения [5] с целью повышения чувствительности.

Один из авторов (С. Д. Г.) благодарит фонд А. фон Гумбольдта за поддержку в работе.

#### Список литературы

- [1] Андрианов А. В., Ивченко Е. Л., Пикус Г. Е., Расулов Р. Я., Ярошецкий И. Д. // ЖЭТФ. 1981. Т. 81. С. 2080.
- [2] Берегулин Е. В., Ганичев С. Д., Глух К. Ю., Лянда-Геллер Ю. Б., Ярошецкий И. Д. // ФТГ. 1988. Т. 30. № 2. С. 730.

- [3] Beregulin E. V., Ganichev S. D., Glookh K. Yu., Lyanda-Geller Yu. B., Yaroshetskii I. D. // Crystal Propertis Preparation. 1989. V. 19. P. 327.
- [4] Берегулин Е. В., Ганичев С. Д., Глух К. Ю., Лянда-Геллер Ю. Б., Ярошецкий И. Д. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 1. С. 115.
- [5] Андрианов А. В., Берегулин Е. В., Ганичев С. Д., Глух К. Ю., Ярошецкий И. Д. // Письма в ЖТФ. 1988. С. 1326.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе РАН  
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию  
29 сентября 1992 г.

---